## XRR 解析レポート

## プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

## 解析条件

波長(nm): 0.15403 点数: 1451

2θ(°):開始 = 0.200,終了 = 6.000 残差タイプ: |Δ(LogI)|

ステップ = 0.004

オフセット=0.000e+000

フィッティング手法: 遺伝的アルゴリズム データ間隔:1点ごとにフィッティング

母集団: 50 個体数: 50

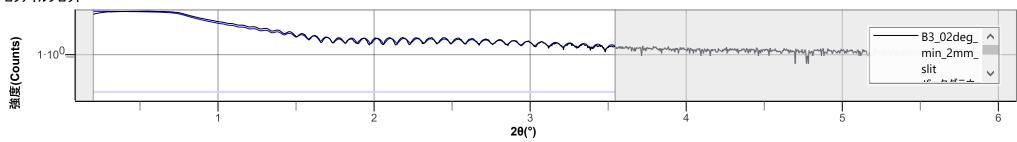
ターゲットχ²: 1.00e-004

重み: 50%

クロスオーバー: 50%

装置関数: 擬Voigt関数 ローレンツ関数の比率: 0.00 ローレンツ幅: 1.00e-002 ガウス幅: 1.00e-002

## 結果 プロファイルプロット



使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)		密度(g/cm³) <d></d>		粗さ(nm) <rgh></rgh>	
<b>✓</b>	L5	Fe2O3	0.775	Const	2.47500	Const	0.236	Con
							±0.014	精密化
<b>✓</b>	L4	Fe2O3	2.352	Const	4.95000	Const	0.262	Con
	L-1						±0.015	精密化
	L3	Fe Fe	0.000	Const	3.93700	Const	5.551	Con
	LJ		±0.5 最小←	精密化	±0.14 最小←	精密化	±0.7	精密化
<b>✓</b>	L2	Fe Fe	93.510	Const	7.86952	Const	0.669	Con
	LZ						±0.011	精密化
V	L1	Fe Fe	1.131	Const	4.39941	Const	0.100	Con
	LI				±0.05	精密化	±0.05最 <b>小</b> ←	精密化
<u> </u>	基板	<b>⊡</b> Si	00		2.32924	Const	0.500	Con